

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

- LIGHT EMITTING ELEMENT OF GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR

Patent Number: JP3252176
Publication date: 1991-11-11
Inventor(s): MANABE KATSUhide; others: 05
Applicant(s): TOYODA GOSEI CO LTD; others: 03
Requested Patent: ☐ JP3252176
Application Number: JP19900050210 19900228
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L33/00; H01L21/205
EC Classification:
Equivalents: JP3193980B2

Abstract

PURPOSE: To increase blue light emitting intensity of a light emitting diode by forming a double layer structure of a low carrier concentration layer and a high carrier concentration layer sequentially from the side of connecting an N-type layer to an I-type layer.

CONSTITUTION: A sapphire board 1 is vapor etched, an AlN buffer layer 2 is formed, a high carrier concentration layer 3 made of GaN is formed, and then an N<+> type low carrier concentration layer 4 made of GaN is formed. Then, an I-type layer 5 made of GaN is formed.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-252176

⑬ Int.Cl.³

H 01 L 33/00
21/205

識別記号

C

庁内整理番号

8934-5F
7739-5F

⑭ 公開 平成3年(1991)11月11日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

⑯ 特 願 平2-50210

⑰ 出 願 平2(1990)2月28日

⑱ 発 明 者 真 部 勝 英 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

⑲ 発 明 者 馬 淵 彰 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

⑳ 出 願 人 豊田合成株式会社 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地

㉑ 出 願 人 株式会社豊田中央研究所 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番地の1

㉒ 出 願 人 名古屋大学長 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし)

㉓ 出 願 人 新技術事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

㉔ 代 理 人 弁理士 藤 谷 修

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

2. 特許請求の範囲

N型の窒化ガリウム系化合物半導体 ($Al_xGa_{1-x}N$; $x=0$ を含む) からなるN層と、P型不純物を添加したI型の窒化ガリウム系化合物半導体 ($Al_xGa_{1-x}N$; $x=0$ を含む) からなるI層とを有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、

前記N層を前記I層と接合する側から順に、低キャリア濃度N層と高キャリア濃度N⁺層との二重層構造としたことを特徴とする発光素子。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は青色発光の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子に関する。

【従来技術】

従来、青色の発光ダイオードとしてGa^{III}系の化合物半導体を用いたものが知られている。そのGa^{III}系の化合物半導体は直接遷移であることから発

光効率が高いこと、光の3原色の1つである青色を発光色とすること等から注目されている。

このようなGa^{III}系の化合物半導体を用いた発光ダイオードは、サファイア基板上に直接又は窒化アルミニウムから成るバッファ層を介在させて、N導電型のGa^{III}系の化合物半導体から成るN層を成長させ、そのN層の上にP型不純物を添加してI型のGa^{III}系の化合物半導体から成るI層を成長させた構造をとっている(特開昭62-119196号公報、特開昭63-188977号公報)。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記構造の発光ダイオードの発光強度は未だ十分ではなく、改良が望まれている。

そこで、本発明の目的は、Ga^{III}系の化合物半導体の発光ダイオードの青色の発光強度を向上させることである。

【課題を解決するための手段】

本発明は、N型の窒化ガリウム系化合物半導体 ($Al_xGa_{1-x}N$; $x=0$ を含む) からなるN層と、P型不純物を添加したI型の窒化ガリウム系化合物半

導体 ($\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$: $x=0$ を含む) からなる1層とを有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、N層を1層と接合する側から順に、低キャリア濃度N層と高キャリア濃度N⁺層との二重層構造としたことである。

尚、上記低キャリア濃度N層のキャリア濃度は $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ で膜厚は $0.5 \sim 2 \mu\text{m}$ が望ましい。キャリア濃度が $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以上となると発光強度が低下するので望ましくなく、 $1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$ 以下となると発光素子の直列抵抗が高くなりすぎ電流を流すと発熱するので望ましくない。又、膜厚が $2 \mu\text{m}$ 以上となると発光素子の直列抵抗が高くなりすぎ電流を流すと発熱するので望ましくなく、膜厚が $0.5 \mu\text{m}$ 以下となると発光強度が低下するので望ましくない。

更に、高キャリア濃度N⁺層のキャリア濃度は $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ で膜厚は $2 \sim 10 \mu\text{m}$ が望ましい。キャリア濃度が $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以上となると結晶性が悪化するので望ましくなく、 $1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$ 以下となると発光素子の直列抵抗が高くなりす

ぎ電流を流すと発熱するので望ましくない。又、膜厚が $10 \mu\text{m}$ 以上となると基板が湾曲するので望ましくなく、膜厚が $2 \mu\text{m}$ 以下となると発光素子の直列抵抗が高くなりすぎ電流を流すと発熱するので望ましくない。

【発明の作用及び効果】

本発明は、N層を1層と接合する側から順に、低キャリア濃度N層と高キャリア濃度N⁺層との二重層構造とすることで、発光ダイオードの青色の発光強度を増加させることができた。

即ち、高キャリア濃度N⁺層によりN層全体の電気抵抗を小さくでき、発光ダイオードの直列抵抗が下がり、発光ダイオードの発熱を抑えることができる。又、1層に接合するN層は低キャリア濃度とすること、つまり GaN を高純度化して発光領域 (1層及びその近傍) の青色発光を劣化させる不純物原子濃度を抑えることができる。以上の作用により青色の発光強度が向上した。

【実施例】

以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明

する。

第1図において、発光ダイオード10は、サファイア基板1を有しており、そのサファイア基板1に500ÅのAlNのバッファ層2が形成されている。そのバッファ層2の上には、順に、膜厚約2.2μmのGaNから成る高キャリア濃度N⁺層3と膜厚約1.5μmのGaNから成る低キャリア濃度N層4が形成されており、更に、低キャリア濃度N層4の上に膜厚約0.2μmのGaNから成る1層5が形成されている。そして、1層5に接換するアルミニウムで形成された電極7と高キャリア濃度N⁺層3に接換するアルミニウムで形成された電極8とが形成されている。

次に、この構造の発光ダイオード10の製造方法について説明する。

上記発光ダイオード10は、有機金属化合物気相成長法 (以下「MOVPE」と記す) による気相成長により製造された。

用いられたガスは、NH₃とキャリアガスH₂とトリメチルガリウム ($\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$) (以下「TMG」と記す) とトリメチルアルミニウム ($\text{Al}(\text{CH}_3)_3$) (以下「TMA」と記す) とシラン (SiH_4) とジエチル亜鉛 (以下「DEZ」と記す) である。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面を主面とする単結晶のサファイア基板1をMOVPE装置の反応室に設置されたサセプタに装着する。

次に、常圧でH₂を流速2ℓ/分で反応室に流しながら温度1100℃でサファイア基板1を気相エッチングした。

次に、温度を400℃まで低下させて、H₂を26ℓ/分、NH₃を10ℓ/分、TMAを 1.8×10^{-4} モル/分で供給してAlNのバッファ層2が約500Åの厚さに形成された。

次に、温度を1150℃に保持し、H₂を20ℓ/分、NH₃を10ℓ/分、TMGを 1.7×10^{-4} モル/分、H₂で0.86ppmまで希釈したシラン (SiH_4) を200ml/分の割合で30分間供給し、膜厚約2.2μm、キャリア濃度 $1.5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ のGaNから成る高キャリア濃度N⁺層3を形成した。

続いて、サファイア基板1の温度を1150℃に保持し、H₂を20ℓ/分、NH₃を10ℓ/分、TMGを 1.7×10^{-4} モル/分、H₂で0.86ppmまで希釈したシラン (SiH_4) を200ml/分の割合で30分間供給し、膜厚約1.5μm、キャリア濃度 $1.5 \times 10^{17}/\text{cm}^3$ のGaNから成る低キャリア濃度N層4を形成した。

最後に、サファイア基板1の温度を1150℃に保

持し、 H_2 を $20 \text{ L} / \text{分}$ 、 NH_3 を $10 \text{ L} / \text{分}$ 、 TMG を $1.7 \times 10^{-4} \text{ モル} / \text{分}$ の割合で 20 分間供給し、厚膜約 1.5μ 、キャリア濃度 $1 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ の GaN から成る低キャリア濃度 N 層 4 を形成した。

次に、サファイヤ基板1を900℃にして、H₂を20ℓ/分、NH₃を10ℓ/分、TMGを 1.7×10^{-4} モル/分、DEZを 1.5×10^{-4} モル/分の割合で2分間供給して、膜厚0.2μmのGaInから成る1層5を形成した。

このようにして、第2図に示すような多層構造が得られた。

次に、第3図に示すように、1層5の上に、スパッタリングによりSiO₂層11を2000Åの厚さに形成した。次に、そのSiO₂層11上にフォトリソレジスト12を塗布して、フォトリソグラフィにより、そのフォトリソレジスト12を高キャリア濃度N⁺層3に対する電極形成部位のフォトリソレジストを除去したパターンに形成した。

次に、第4図に示すように、フォトレジスト12によって覆われていないSiO₂層11をフッ酸系

層 3 の電極 8、1 層 5 の電極 7 を形成した。

このようにして、第1図に示すMIS(Metal-Insulator Semiconductor)構造の窒化ガリウム系発光素を製造することができる。

このようにして製造された発光ダイオード10の発光強度を測定したところ、0.2mcdであった。

れは、単純に1層とキャリア濃度 $5 \times 10^{17} / \text{cm}^3$ 、厚さ4μmのN層とを接した従来の発光ダイオードに比べて、発光強度が4倍に向上した。

又、発光面を観察した所、発光点の数が増加していることも観察された。

向、比較のために、低キャリア濃度N層4のキャリア濃度を各種変化させた上記試料を製造して、発光強度及び発光スペクトラムを測定した。その結果を、第8図に示す。

キャリア密度が増加するに連れて、発光強度が減少し、且つ、発光波長が赤色側に変位することが分かる。このことは、ドーピング元素のシリコンが1層5に不純物元素として拡散または遷入するためであると思われる。

エッチング液で除去した。

次に、第5図に示すように、フォトレジスト12及びSiO₂層11によって覆われていない部位の1層5とその下の低キャリア濃度N層4と高キャリア濃度N⁺層3の上面一部を、真空度0.04Torr、高周波電力0.44W/cm²、CCl₄F₃ガスを10ml/分の割合で供給しドライエッチングした後、Arでドライエッチングした。

次に、第6図に示すように、1層5上に残っているSiO₂層11をフッ酸で除去した。

次に、第7図に示すように、試料の上全面に、
A層13を蒸着により形成した。そして、そのA層13の上にフォトレジスト14を塗布して、フォトリソグラフにより、そのフォトレジスト14が高キャリア濃度N⁺層3及びI層5に対する電極が設けられるように、所定形状にパターン形成した。

次に、第7図に示すようにそのフォトレジスト14をマスクとして下層のA2層13の露出部を銅酸系エッチング液でエッチングし、フォトレジスト14をアセトンで除去し、高キャリア濃度N⁺

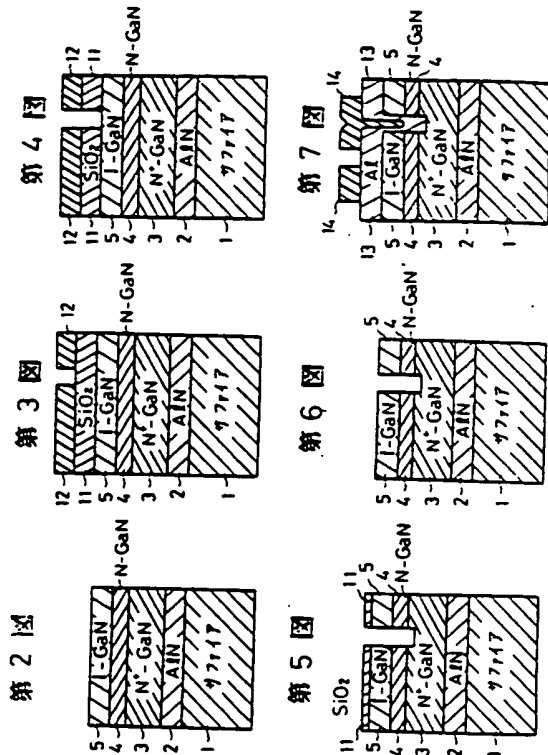
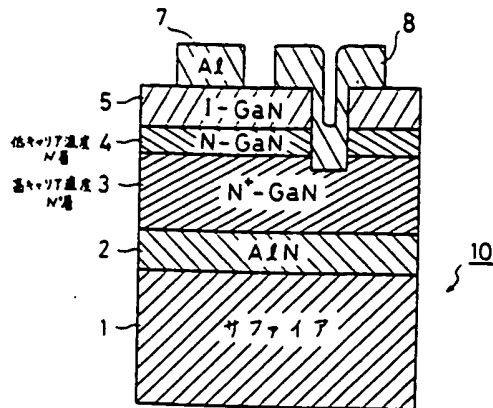
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の具体的な一実施例に係る発光ダイオードの構成を示した構成図、第2図乃至第7図は同実施例の発光ダイオードの製造工程を示した断面図、第8図は低キャリア濃度N層のキャリア濃度と発光強度及び発光波長との関係を示した測定図である。

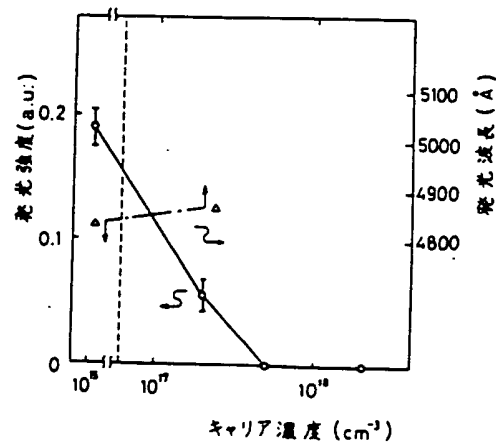
- 1 0 ……発光ダイオード 1 ……サファイア基板
2 ……バッファ層 3 ……高キャリア濃度N⁺層
4 ……低キャリア濃度N層 5 ……I層
7, 8 ……電極

特許出願人	豊田合成株式会社
特許出願人	株式会社豊田中央研究所
特許出願人	名古屋大学
特許出願人	新技術事業団
代理人	弁理士 藤谷 健

第1図



第8図



第1頁の続き

⑩発明者	加藤	久喜	愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内
⑪発明者	佐々	道成	愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内
⑫発明者	橋本	雅文	愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番地の1 株式会社豊田中央研究所内
⑬発明者	赤崎	勇	愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内